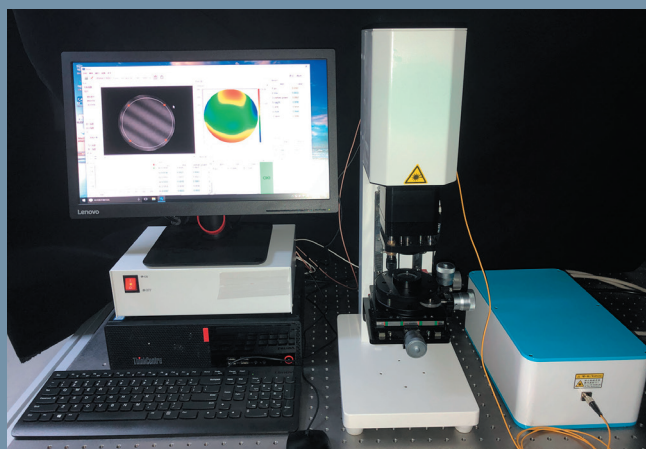


短相干激光干涉仪

Short Coherence Laser Interferometer



主要技术与性能指标

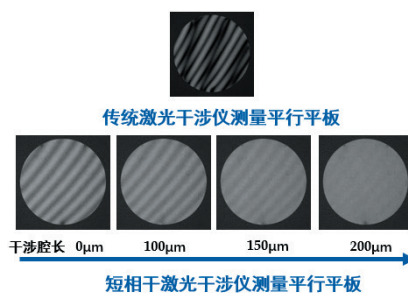
- 最大测量口径：30 mm、60 mm、100 mm
- 平面面形精度 PV：优于 $\lambda/20@633\text{ nm}$
- 可测最小平行平板厚度：0.2 mm

主要应用

平行平板光学元件面形检测

代表性应用成果

- 手机摄像头窗口、背板检测
- 蓝宝石玻璃基底检测
- 分光平片检测



主要用户单位	中国科学院西安光学精密机械研究所、中国科学院大连化学物理研究所、上海乾曜光电有限公司
研制单位	中国科学院空天信息创新研究院
联系方式	李杨 010-82178622, 18710020052 liyang@aoe.ac.cn